

동시 DUAL VIEW ICP-OES

신속하고 정확한 분석 지원

The Measure of Confidence

Agilent 5100 ICP-OES



역사상 가장 빠른 ICP-OES...

Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View(SVDV) ICP-OES는 ICP-OES 분석에 혁명을 일으킵니다. 고유한 Dichroic Spectral Combiner(DSC) 기술을 통해 이제부터 Axial 및 Radial 양방향 관측을 동시에 실행할 수 있습니다.

시간과 비용 절약

- 최소 시간 내에 보다 적은 가스로 샘플을 분석
- 한 번의 측정으로 모든 파장을 정밀하게 측정
- 가스퍼징이 불필요한 검출기 도입으로 최소 예열시간으로 분석 시작

최고의 성능

- 수직 토치를 사용하여 고매질 시료부터 휘발성 유기 용매까지 안정적으로 분석
- 안정적인 플라즈마를 제공하는 Solid-State RF 시스템으로 분석 안정성 증대

분석의 간소화

- 고객 친화적인 ICP Expert Software와 DSC 기술이 분석법 설정을 용이하게 해 줌
- 강력한 소프트웨어 알고리즘이 분석법 개발을 간소화하고 정확성을 개선하고 측정 범위를 넓혀줌

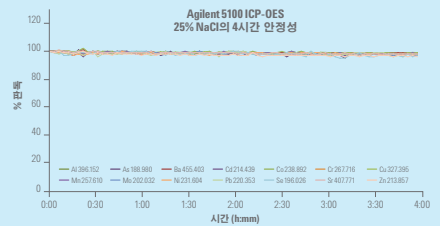
유연한 구성

Agilent 5100은 세 가지 구성으로 제공됩니다.

- Synchronous Vertical Dual View.
- Vertical Dual View.
- Radial View.

견고성 및 안정성

모든 구성에서 수직 토치(torch)와 견고한 Solid State RF를 사용하는 5100 ICP-OES는 가장 까다로운 시료도 쉽고 빠르게 직접 분석이 가능합니다.



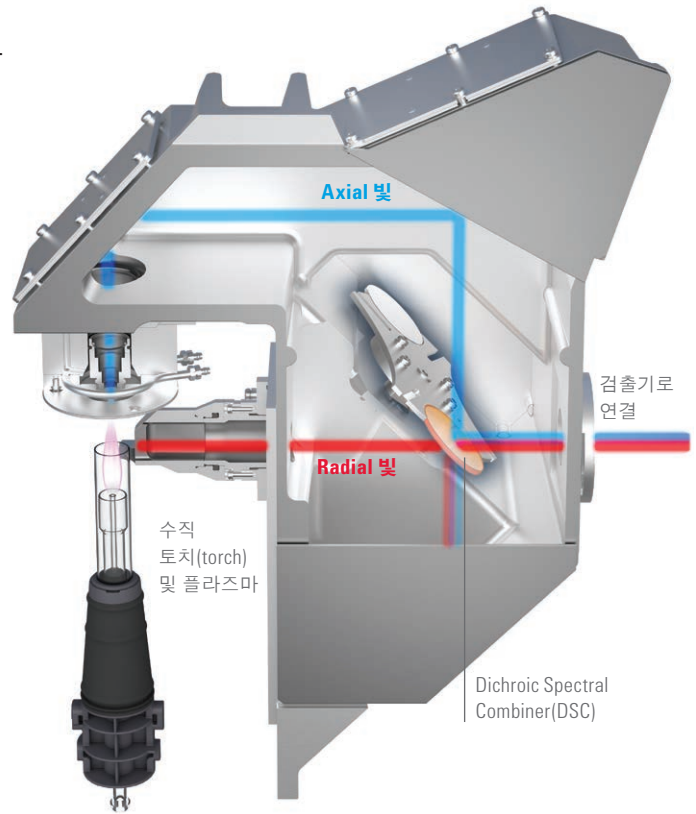
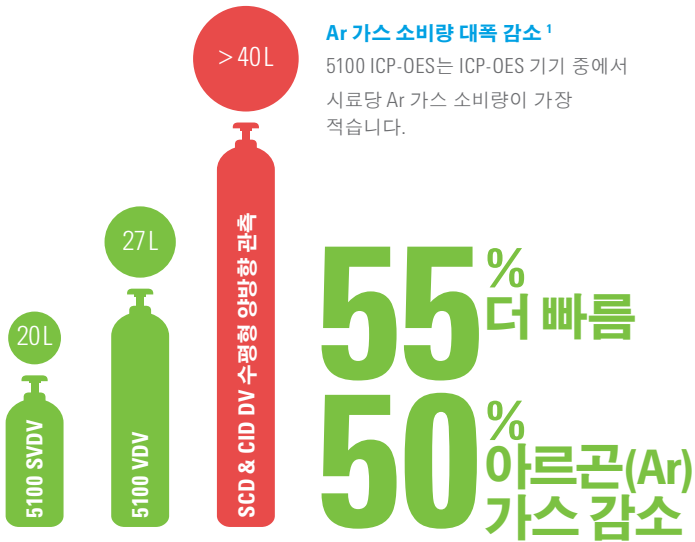
위 그림은 25% NaCl용액에서 여러 원소를 동시에 측정한 결과입니다. 4시간 이상 연속 분석 과정에서 내부 표준물 사용없이 모든 원소의 안정성은 1.3% RSD미만입니다.



Agilent Technologies

Synchronous Vertical Dual View(SVDV) 작동 방식

5100 SVDV ICP-OES는 시료당 한 번의 측정만 필요합니다. Dichroic Spectral Combiner를 통해 한 번의 판독으로 동시에 Axial 및 Radial 관측이 가능합니다. 이를 통해 최단 시간 내에 정확한 결과를 제공합니다¹.



1. 분석 속도와 가스 소비 수치는 공개된 응용 데이터를 기반으로 경쟁 시스템과 비교한 것입니다. 애질런트 응용 자료 5991-4821EN을 참조하십시오.

알고 계십니까?

일반적인 dual view ICP-OES 시스템의 경우 Axial 모드에서 측정할 원소와 Radial 모드에서 측정할 원소를 선택함으로써 순차적 측정을 설정해야 합니다.

또한 일부 시스템의 경우 두 개의 슬릿을 사용하여 전체 파장을 두 파트로 분리하여 측정하므로 결과적으로 각 시료에 대해 최대 4번의 순차측정이 수행되어 시료 처리량이 지연됩니다.

세부 정보 참조:
애질런트 담당자에게 문의하시거나
다음 페이지를 방문하십시오.
www.agilent.com/chem/5100icpoes

이 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2014
2014년 7월 1일 화요일 인쇄
5991-4835K0

경기도 수원시 영통구 광교로 109 9층 (KANC) 우)443-270
서울 강남구 역삼로 542 신사제2빌딩 2층 우)135-848
한국애질런트테크놀로지스(주) 생명과학/화학분석 사업부
고객지원센터 080-004-5090 www.agilent.co.kr

